

非破壊の異物解析はおまかせください

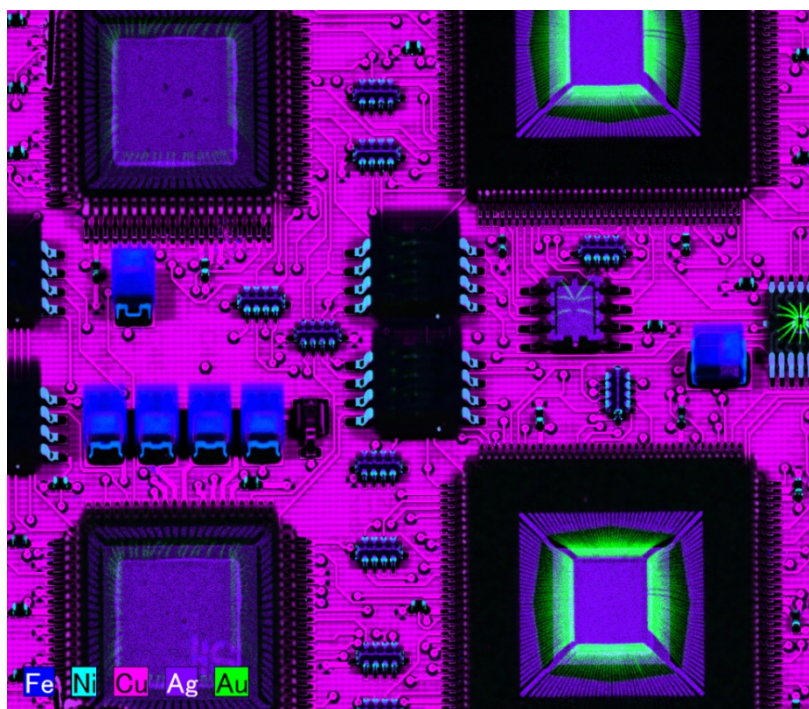
蛍光X線を用いた異物分析

詳細はこちら www.oeg.co.jp/env_meas/xrf.html

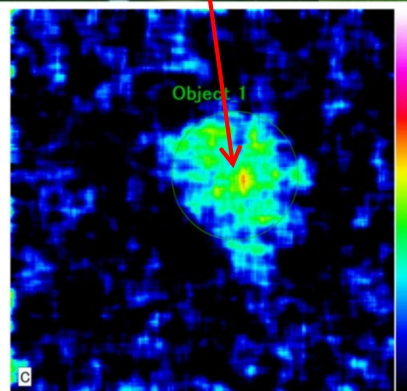
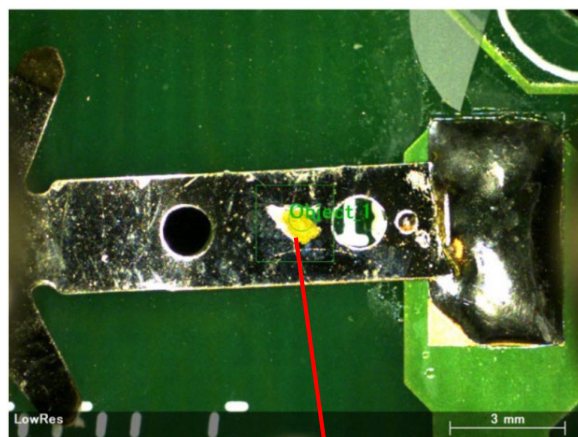
概要 異物解析における元素分析は、主に走査型電子顕微鏡（SEM・SEM-EDX）、電子線マイクロアナライザ（EPMA）で対応しておりましたが、蛍光X線分析装置は非破壊で解析できる装置として有効です。新たに導入した蛍光X線分析装置（XRF）は、低元素のCから定性できることから、定性で解析できる幅が広がりました。フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）などの有機物の解析を含めて、適切な分析手法にて分析を行い、異物の定性分析をすることもご提供可能です。

- 特長**
- C～Amまで、幅広い元素の定性が可能です。（以前のXRFの定性ではNa～U）
 - 最大マッピングサイズが190×150mmと大きく、広範囲の確認が可能です。
 - 検出器と測定したい対象物との距離が10mm程度まで可能で、当社の他装置では破壊試験となっていたものが、非破壊にて対応できる可能性が広がります。
 - 真空のほかに、大気、He置換での解析が可能であることから、液体サンプルの解析も可能です。

異物解析例



マッピング事例：基板全体把握



マッピング事例：炭素異物解析

- 基板全体の元素分布の把握が高感度にて対応が可能です。
- 従来の蛍光X線分析ではCの測定は行えませんでした。新規設備ではCからの測定が可能となったため、非破壊での炭素からの付着物解析が可能になりました。